

# 表面計測・解析技術セミナー2016

～材料物性（機械特性および電気特性）の最新技術と表面計測システムの最新情報～

ブルカーナノ表面計測事業部では11月15日（大阪会場）及び17日（東京会場）に「表面計測・解析技術セミナー2016 ～材料物性（機械特性および電気特性）の最新技術と表面計測システムの最新情報～」を開催致します。本年のセミナーでは、この秋バージョンアップして新登場のPeakForce QNMによる機械特性測定のご紹介をはじめ、新たなマイクロ波インピーダンス顕微鏡を含む電気特性測定の解説を中心に開催いたします。その他に、ブルカーナノ表面計測装置の最新技術についても解説させていただきます。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

ブルカーナノ表面計測事業部

## 開催要綱

	大阪会場	東京会場
日時	11月15日（火）10:00～17:30	11月17日（木）10:00～17:30 ※セミナー終了後に懇親会を行います。
会場	弊社 大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル 3F Tel:06-6393-7822	貸会議室スペース まる八 茅場町 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-12-2 樋口本店ビル8F Tel:03-3666-3636
最寄駅	新大阪駅 / JR・地下鉄御堂筋線	茅場町駅 / 東京メトロ 東西線、日比谷線 茅場町駅3番出口を出てすぐ、永代通り沿いのスターバックスコーヒーのあるビルの8Fです
定員	20名	45名
参加費	無料	無料
お問合せ	Telまたはメールにて： <b>E-mail: info-nano.baxs.jp@bruker.com</b> ブルカーナノ表面計測事業部 セミナー担当 <b>Tel : 03-3523-6361</b>	

## アクセスマップ



# ● プログラム

(プログラムの内容が変更の場合はご容赦ください。)

時間	内容
10:00~10:10	開会のご挨拶
10:10~11:40	最新の機械特性測定のご紹介 講演：Bruker WW Application Director, Peter Dewolf, PhD
11:40~12:10	ブルカーAFM製品群のご紹介
12:10~13:00	昼食 (※弊社にてお弁当をご用意いたします)
13:00~14:30	sMIM (マイクロ波インピーダンス顕微鏡)のご紹介 講演：PrimeNano Inc.社 Amster Oskar氏
14:30~15:00	SCM/SSRM/TUNA等の電気特性測定のご紹介
15:00~15:15	休憩
15:15~15:35	白色光干渉型顕微鏡、触針式段差計のご紹介
15:35~15:55	ナノインデンテーションと摩擦摩耗試験機のご紹介
15:55~16:00	休憩 (※東京会場では、この時間にスペースまる八からブルカーオフィスへ移動いたします)
16:00~17:20	装置デモンストレーション
17:20~17:30	Q&A、アンケート

※11/17 (木) の東京会場では、セミナー終了後に懇親会を行います。是非ご参加ください。

## ● 参加のお申し込み

セミナーへの参加をご希望の方は、Fax、メールにてお申込みください。

**Fax : 03-3523-6364**

**E-mail : info-nano.BAXS.jp@bruker.com**



## 参加申込書



\*以下の項目をご記入ください。

ご希望の日時にチェック (✓、○等) をお付けください。

【  】 11月15日 (火) 大阪会場

【  】 11月17日 (木) 東京会場

勤務先名：

ご所属部署：

お名前：

メールアドレス：

ご住所：〒

Tel：

Fax：

※お申し込みの締め切りは定員になり次第、または11月10日 (木) 17時までとさせていただきます。

### ● ブルカーナノ表面計測事業部

ブルカー・エイエックスエス株式会社

東京営業所：〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1

Phone: 03-3523-6361 Fax: 03-3523-6364

大阪営業所：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル

Phone: 06-6393-7822 Fax: 06-6393-7824